_	earch Notes	:

Applica	tion/Cor	ntrol No.
---------	----------	-----------

10/642,364

Examiner

Anthony Weier

Applicant(s)/Patent under Reexamination

JAYALEKSHMY ET AL.

Art Unit

1794

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	previous search	10/29/2007	AW
		·	
			1 1 7
	·		
-	-		
		<u> </u>	

INTERFERENCE SEARCHED								
Class	Subclass		Date		E	xar	nin	er
			1	<u> </u>	Ė			<del>; ; ; ;</del>
	<del> </del>	-			-	<u> </u>		<del>  .</del>
•		-			Ŀ			: :
								1 !!
								,
					1.		,.	13
		<u> </u>			ŀ.			1 1

•	!		ŀ	DATE	EXMR
		:			
i :			.'		
			١.		
,	·				
;	ŧ				
<u>.</u>			· ·		
				•	
			,		
,	i ·				
		+ 1	, ,		
		·			
			:		
•					
<u>.</u>					
			:		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · : - · · ·			
	,				
:	. ;	: '	.'		
	·				